

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Сухих Александра Сергеевича
«РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОЕВ
НEZАМЕЩЕННЫХ И ЗАМЕЩЕННЫХ ФТАЛОЦИАНИНОВ MPc (M = Co, Pd, Zn, VO)»
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 02.00.04 – физическая химия

Фталоцианины представляют собой обширный класс макрогетероциклических соединений, широко используемых в промышленности. Большинство из них легко образуют упорядоченные тонкие пленки, обладают фотопроводимостью и высокой каталитической активностью. В настоящее время фталоцианины привлекают внимание как модели фотофизических процессов, материалы для электрохромных дисплеев и среды для оптической регистрации информации, на основе тонких пленок созданы полупроводниковые диоды, органические светодиоды, солнечные батареи и полевые транзисторы. Фталоцианины плохо растворимы в органических растворителях, что затрудняет их исследование. Восстановленные фталоцианины получают, в основном, допированием фталоцианинов щелочными металлами. Таким методом можно получить соединения, преимущественно, только в виде порошков или пленок, что существенно затрудняет их детальное изучение, например, проблемой часто является идентификация фазового состава и кристаллической структуры тонких пленок фталоцианинов. Поэтому, несмотря на огромное количество работ, посвященных исследованию фталоцианинов и их производных, имеется целый ряд не изученных областей. Таким образом, существует потребность как в развитии методов дифракционного анализа тонких пленок фталоцианинов, так и в изучении свойств и кристаллической структуры модификаций многих фталоцианинов, в т.ч. фторзамещенных, чему и посвящена диссертационная работа Сухих А.С.

В качестве основного инструмента для дифракционных исследований тонких пленок фталоцианинов автором реализована геометрия 2D GIXD на серийном монокристальном дифрактометре, оснащенном 2D детектором. Данный инструмент обеспечил определение фазового состава и направления преимущественной ориентации при наличии нескольких полиморфных модификаций, определение изоструктурности кристаллических фаз, исследование тонких слоев смешанного состава, исследование влияния условий нанесения на структурную организацию слоев, *ex situ* и *in situ* исследования фазовых превращений. Выращены монокристаллы ряда незамещенных (PdPc) и фторзамещенных фталоцианинов *MPcF₄* (*M*=Pd, Co, Zn) и *MPcF₁₆* (*M*=Pd, VO) и изучены кристаллические структуры 8 полиморфных фаз. С использованием данных 2D GIXD определен фазовый состав и параметры элементарной ячейки тонких слоев, выполнены температурные исследования ряда образцов, в частности, *in situ* процесс фазового перехода в тонких слоях *VOPcF₁₆*. На примере замещенных и незамещенных фталоцианинов металлов продемонстрирован широкий спектр возможностей 2D GIXD при анализе их тонких ориентированных слоев. Основные результаты опубликованы в 7 статьях в рецензируемых научных журналах, входящих в международную базу научного цитирования Web of Science, и в 5 тезисах.

В целом, диссертационные исследования достаточно ясно и подробно освещены в автореферате, поэтому существенных замечаний по нему нет. В качестве замечания можно отметить, что в некоторых случаях результаты все-же следовало представить более понятно. Например, на рис. 3 (б) не указано, от какой кристаллографической плоскости изучаемого образца *PdPcF₄* получен данный рефлекс, на рис. 5 «упаковки изученных кристаллических структур» не указаны их ориентации относительно осей ячеек.

Сделанное замечание не влияет на общую положительную оценку работы, которая выполнена на высоком научном уровне, а ее автор – Сухих Александр Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия.

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Композиционные материалы и физикохимия metallургических процессов» Сибирского федерального университета

Якимов Игорь Степанович

660095 Красноярск, пр. Красноярский рабочий 95, СФУ.

e-mail: i-s-yakimov@yandex.ru

тел. 8-913-559-2666

11 января 2019г.

Подпись Якимова И. С. заверяю:

